ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАЗМЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

С.А. Баранов*,**

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МИКРО- И НАНОПРОВОДА В ОБЛАСТИ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

^{*}Институт прикладной физики АН Республики Молдова, ул. Академией, 5, г. Кишинев, MD–20028, Республика Молдова **Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, ул. 25 Октября, 128, г. Тирасполь, Республика Молдова, baranov@phys.asm.md

Введение

Современные технологии позволяют получать микро- и нанообъекты, в частности в виде микро- и нанопроводов (МНП). Изучение электродинамических свойств таких проводов (МНП) сложно из-за их микроскопических размеров. Поэтому возрастает роль бесконтактных методов исследования электродинамических свойств МНП, которые разработаны для области сверхвысоких частот (СВЧ).

Кроме того, применение микро- и нанопроводов для получения метаматериалов непосредственно связано, в частности, с практическими применениями этих материалов, которые обычно имеют уникальные высокочастотные свойства (см., например, [1–3]). С помощью микро- и нанопроводов изготовляются уникальные радиопоглощающие экраны (управляемые внешними полями). Возможно также создание материалов с отрицательной дисперсией [4, 5] и других устройств, работающих в данном диапазоне электромагнитного поля.

В работе исследуются теоретические подходы, позволяющие анализировать экспериментальные результаты. Отметим, что данные теоретические подходы развивались впервые в работе [6], результаты которой здесь обсуждаются. Получены и новые результаты, позволяющие анализировать эксперименты по изучению высокочастотных свойств нано- и микропроводов.

Определение импеданса провода в случае отсутствия частотной дисперсии магнитной проницаемости

В проводнике переменный ток, в отличие от постоянного, распределяется неравномерно по его сечению, а концентрируется по поверхности. Это явление называется скин-эффектом и влечет за собой изменение эффективного сопротивления и самоиндукции. Ниже приведем решение уравнений Максвелла для цилиндрических проводников, но начнем с простейшего анализа полуплоскости.

Будем исходить из уравнений для электромагнитного поля (уравнений Максвелла) в системе СГС:

$$rot \quad E = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} , \qquad (1)$$

$$rot \quad H = \frac{4\pi\sigma}{c}E + \frac{1}{c}\frac{\partial D}{\partial t},$$
(2)

где σ – удельная проводимость, µ – магнитная проницаемость (*с* – скорость света в пустоте).

Плотность тока смещения в проводниках мала по сравнению с плотностью токов проводимости, поэтому во втором уравнении, пренебрегая вторым членом, получим

$$\nabla^{2}E = \frac{4\pi\sigma\mu}{c^{2}}\frac{\partial E}{\partial t};$$

$$\nabla^{2}H = \frac{4\pi\sigma\mu}{c}\frac{\partial H}{\partial t}.$$
(3)

[©] Баранов С.А., Электронная обработка материалов, 2009, № 6, С. 4–11.

Для монохроматического поля частоты ω:

$$\nabla^2 E = 2ip^2 E,\tag{4}$$

где

$$p^2 = \frac{2\pi\mu\sigma\omega}{c^2}$$

В упрощенном случае, когда бесконечный однородный проводник занимает полупространство так, что его поверхность совпадает с плоскостью z = 0, электрическое поле, а следовательно, и ток направлены вдоль оси $X : (E_Y = E_Z = 0)$. Пусть E зависит от расстояния рассматриваемой точки проводника от его поверхности, но не зависит от X, Y.

В этом случае из (3) несложно получить уравнение

$$\nabla^2 E_x = \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = 2ip^2 E_x \tag{5}$$

общее решение которого:

$$E_x = Ae^{kz} + Be^{-kz}.$$

Для этого уравнения (ниже и для более сложных случаев) мы будем использовать комплексный вектор *k*, модуль которого будем обозначать *p*:

 $k = p\left(1+i\right) \,.$

Выберем только затухающее решение:

$$E_x = Be^{-pz}e^{i(\omega t - pz)} {.} {(6)}$$

Используя действительную часть данного решения, получим решение в привычном виде:

$$E_x = Be^{-pz}\cos(\omega t - pz). \tag{7}$$

Плотность тока выражается формулой

$$j_x = j_0 e^{-pz} \cos(\omega t - pz). \tag{8}$$

Следовательно, по мере проникновения в глубь проводника фаза электрического вектора изменяется линейно, а амплитуда убывает по экспоненциальному закону. При этом основную часть тока можно считать сосредоточенной в поверхностном слое, величина которого

$$\delta = 1/p$$
.

На этой глубине плотность тока уже в *e* раз меньше плотности тока у поверхности проводника. Введенные параметры (δ , *k*, *p*) можно использовать для анализа цилиндрических проводников, а выводы качественного поведения электромагнитного поля также полезны для анализа более сложного случая. Отметим, что для сравнения часто используют указанные параметры для немагнитных образцов (когда магнитная проницаемость $\mu = 1$), и в этом случае будем обозначать их – δ_0 , k_0 , p_0 .

В цилиндрическом проводнике, переменный ток также концентрируется на его поверхности тем сильнее, чем больше частота тока. Концентрация тока на поверхности влечет за собой изменение сопротивления и самоиндукции, а следовательно, эти изменения величины зависят от частоты тока. Если весь ток концентрируется в поверхностном слое цилиндрического провода, то сопротивление последнего должно приближаться к сопротивлению цилиндрической поверхности, обладающей стенками соответствующей толщины (порядка δ). По мере увеличения частоты толщина проводящего слоя уменьшается, поэтому сопротивление проводника должно увеличиваться. Так как анализ плоскости для нас интересен только в сравнении с цилиндрическим проводником, то перейдем к этому случаю.

Рассмотрим цилиндрический проводник радиуса $r_0 \equiv r_{xc}$. Введем цилиндрическую систему координат, ось которой совпадает с осью цилиндрического провода. За направление поля *E* примем направление по оси провода. Напряженность *E* равна проекции *E* на ось *z* по модулю, зависит только от координаты *r*. В этом случае уравнения типа (3)–(5) записываются в виде

$$\frac{d^2E}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{dE}{dr} - 2ip^2E = 0.$$
 (9)

Существует только одно решение (с точностью до произвольного постоянного множителя) уравнения, которое остается конечным на оси провода: это решение носит название функции Бесселя нулевого порядка от аргумента $pr\sqrt{-2i}$:

$$E = const \ J_0 \Big(pr \sqrt{-2i} \Big). \tag{10}$$

Асимптотические выражения имеют вид, если

то

$$J_0\left(pr\sqrt{-2i}\right) \cong 1 + \frac{i(pr_0)^2}{2} - \frac{(pr_0)^4}{4} , \qquad (11)$$

и если

то

 $pr_0 >> 1$, или $r_0 >> \delta$,

$$J_0(pr\sqrt{-2i}) \cong A \frac{e^{pr_0 - i(pr_0 - \pi/8)}}{\sqrt{2\pi pr_0}}.$$
 (12)

Амплитуда действительной части плотности тока будет возрастать при удалении от оси тока пропорционально:

$$1+\frac{(pr)^4}{16}.$$

В случае больших частот и толстых проводов *pr*₀ >>1 можно использовать приближенное выражение:

$$E \sim \text{const} \quad \frac{e^{pr-i(pr-\pi/8)}}{\sqrt{r}} \quad .$$
 (13)

При достаточном удалении от провода это выражение можно экстраполировать в виде (чтобы сравнить этот результат с формулами (6) и (7))

$$E_{z} \sim Ae^{-p(r_{0}-r)}\cos\left(\omega t + \pi/8 - pr\right).$$
⁽¹⁴⁾

Асимптотическая формула для тока выразится

$$j \approx C e^{-p(r_0 - r)} \cos\left(\omega t + \pi/8 - pr\right) \qquad (15)$$

Как видно из формулы (15), плотность тока экспоненциально убывает по мере удаления от поверхности проводника в глубь проводника, то есть основная часть тока сосредоточивается в поверхностном слое, что полностью соответствует аналогичной формуле (8).

Для напряженности электрического поля в общем виде

$$E_z = \text{const } J_0(kr)e^{-i\omega t}$$
(16a)

(для удобства опять используется комплексный волновой вектор $k = (1 + i) p = (1 + i)/\delta$).

Для напряженности магнитного поля, используя уравнение Максвелла (формулы (1), (2)), получаем:

$$\frac{i\omega}{c}H_{\varphi} = rot_{\varphi}E = -\frac{\partial E_z}{\partial r}$$

Так как

$$J_0'(x) = -J_1(x),$$

то окончательно для напряженности магнитного поля

$$H_{\varphi} = -i \quad \text{const}\sqrt{\frac{4\pi\sigma \ i}{\omega}}J_1(kr)e^{-i\omega t}.$$
(16b)

Отметим, что одинаковый множитель const входит в электрическое и магнитное поле. На поверхности проводника можно считать, что

$$H = \frac{2I}{cr_0}$$

В принципе, можно выразить величину данной константы через электрический ток *I*. (Последнее эквивалентно так называемому граничному условию Леонтовича – Щукина и не всегда справедливо для малых частиц.)

Запишем результат для отношения электрического поля к магнитному, которое определяет погонное комплексное сопротивление провода (то есть комплексное сопротивление единицы длины провода):

$$Z = \left(\frac{k}{2\pi\sigma r_{0}}\right) \frac{J_{0}(kr_{0})}{J_{1}(kr_{0})} = R_{nos.}k \frac{J_{0}(kr_{0})}{J_{1}(kr_{0})} = R_{noronhoe}\left(\frac{kr_{0}}{2}\right) \frac{J_{0}(kr_{0})}{J_{1}(kr_{0})}$$
(17)

где введено понятие удельного поверхностного либо погонного сопротивления на постоянном токе:

$$R_{noe.} = \frac{1}{2\pi r_0 \sigma} ; \qquad R_{noronhoe} = \frac{1}{\pi r_0^2 \sigma}$$
(18)

Полученная формула (17), вообще говоря, не зависит от граничных условий и имеет достаточно общий характер для микро- и нанопроводов.

Формула (17) (см., например, [6–9]) очень популярна для экспериментальных анализов, но область ее применимости ограничена не учетом магнитного резонанса, который часто имеет место в ферромагнитных материалах. Ниже рассмотрим теорию с учетом ферромагнитного резонанса (ФМР).

Линеаризованные уравнения Ландау и Лившица для аморфного ферромагнетика

Ферромагнитные свойства вещества описываются уравнением Ландау - Лифшица:

$$\frac{dM}{dt} = -\gamma \left[M \times \hat{H} \right],\tag{19}$$

где: γ – гиромагнитное отношение, $\hat{H} = H_{o\delta M} + H_{ahu3} + H_{shewn}$; $H_{o\delta M} = \alpha \nabla^2 M$; H_{ahu3} – внутреннее поле, которое является полем анизотропии и которое в случае аморфного ферромагнетика пропорционально механическим напряжениям и магнитострикции H_{shewn} – внешнее магнитное поле.

Для линеаризации уравнения рассмотрим намагниченность системы в виде постоянной и маленькой переменной (зависящей от времени) части:

$$M = M_0 + m(t). \tag{20}$$

Будем пренебрегать членами второго порядка малости, считая, что внешнее поле

$$H_{\rm gheuh} = H_0 + h(t) \tag{21}$$

также состоит из постоянной и маленькой переменной (зависящей от времени) части.

Представим линеаризованный вариант уравнения (19) в декартовых координатах, полагая:

$$m(t) \approx m e^{-i\omega t}$$
, (22)

где введен двухкомпонентный вектор $-m(m_x, m_y)$.

Тогда уравнение (21) имеет вид

$$i\omega \quad m_x = -\gamma \quad \hat{H} \quad m_y - \gamma \quad M_0 h_y;$$

$$-i\omega \quad m_y = \gamma \quad \hat{H} \quad m_x + \gamma \quad M_0 \quad h_y.$$
(23)

Уравнения (14) можно диагонализировать, введя координаты с векторами:

$$a_{+} = x \pm i y \,. \tag{24}$$

Используя их свойства, получим для вектора намагниченности

$$M_{\pm} = \frac{\omega_M}{\omega_H \pm \omega} \,. \tag{25}$$

Здесь

$$\omega_M = \gamma \ M_0; \ \omega_H = \gamma \ \hat{H} . \tag{26}$$

Введем резонансную и нерезонансную магнитные проницаемости:

$$\mu_{\pm} \sim \frac{\omega_M}{\omega_H \pm \omega}.$$
(27)

Учет релаксационных явлений осуществим заменой ω на $\tilde{\omega} \rightarrow \omega - i\gamma$, где γ отвечает за ширину ферромагнитного резонанса.

Дисперсия цилиндрических волн в аморфном проводе

Начнем с преобразований уравнений Максвелла во вращающейся системе координат. Рассмотрим формулу

$$\nabla \times \left[\nabla \times H \right] = \nabla \left(\nabla \cdot H \right) - \nabla^2 H$$

Первый член в правой части этой формулы в неподвижной системе равен нулю, однако во вращающейся системе его необходимо учитывать.

Запишем уравнение Максвелла во вращающейся системе координат:

$$B_{-} = i\mu_{0} \frac{\delta_{0}^{2}}{4} \left(\nabla^{-}\nabla^{-}H_{+} - \nabla^{+}\nabla^{-}H_{-} \right);$$

$$B_{+} = i\mu_{0} \frac{\delta_{0}^{2}}{4} \left(\nabla^{+}\nabla^{+}H_{-} - \nabla^{+}\nabla^{-}H_{+} \right) .$$
(28)

Общее решение уравнений представим в виде ряда по собственным функциям оператора ∇^2 в цилиндрической системе координат (выбираем лишь функции, которые не расходятся, при $r \to 0$). Такие функции имеют вид

$$f_n(kr) = e^{in\varphi} J_n(kr) , \qquad (29)$$

k – константа распространения.

Существует предельный случай перехода к формулам (16а, b), когда:

$$E \sim J_0(k_0 r);$$

 $H \sim J_1(k_0 r)$. (30)

Представим набла оператор в виде

$$\nabla^{\pm} = \frac{\partial}{\partial x} \pm i \frac{\partial}{\partial y} \,.$$

Данный оператор в сферической системе координат

$$\nabla^{\pm} = \frac{\partial}{\partial r} e^{\pm i\varphi} \pm \frac{i}{r} e^{\pm i\varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

Тогда, пользуясь соотношениями для функций Бесселя: $\rho J'_n(\rho) = -n J_n(\rho) + \rho J_{n-1}(\rho)$,

$$\rho \quad J'_n(\rho) = n \quad J_n(\rho) - \rho \quad J_{n+1}(\rho),$$

получаем

$$\nabla^{\pm} f_n(kr) = \pm n f_{n\pm 1}(kr).$$
(31)

Введенные набла операторы являются аналогами операторов рождения и уничтожения.

Пользуясь свойствами функций (их ортогональностью), представим разложение H, B в ряд по собственным функциям, где значение параметра волнового вектора K еще не определено (он здесь представлен, как неопределенный параметр задачи), а n изменяется от 1 до бесконечности.

$$H_{\pm} = \sum_{n} H_{n}^{\pm} f_{n\pm 1}(kr); \quad B_{\pm} = \sum_{n} B_{n}^{\pm} f_{n\pm 1}(kr)$$

Для амплитуды разложения получим (введя пока еще не определенный безразмерный волновой вектор *K*)

$$B_{n\pm} = iK^{2} \left(H_{n}^{+} + H_{n}^{-} \right); \quad B_{n\pm} = \mu_{\pm} \cdot H_{n}^{\pm}; \quad K^{2} = \mu_{0} \delta_{0}^{2} \frac{k^{2}}{4}.$$
(32)

Для однородной системы имеет место нетривиальное решение лишь в случае, если определитель системы равен нулю. Получаем уравнение на определение параметра K:

$$\begin{vmatrix} iK^{2} + \mu_{+} & iK^{2} \\ iK^{2} & iK^{2} + \mu_{-} \end{vmatrix} = 0.$$
(33)

Отсюда:

$$\mu_{-}\mu_{+} + iK^{2}(\mu_{+} + \mu_{-}) = 0 .$$
(34)

Уравнение дисперсии относительно параметра K, если его расшифровать, представляет собой бикубическое уравнение. Следовательно, оно описывает три вида дисперсии. Это дисперсия основных, спиновых и поверхностных волн (спиновые и поверхностные волны ниже обсуждаться не будут).

Если характерные размеры объекта меньше длины волны, то (соответственно условию Леонтовича - Щукина) можно ввести понятие импеданса $Z(\omega)$, который характеризует соотношение между модами E и H, на границе проводника в виде

$$E_{\omega} = Z(\omega) \cdot H_{\omega}. \tag{35}$$

Для нахождения $Z(\omega)$ пишутся известные граничные условия, которые в нашем случае выражаются в виде условий непрерывности H_{φ} и E_z на границе проводника (необходимо перейти в цилиндрическую систему координат). Из-за громоздкости этих соотношений, приводить их здесь не будем.

Так как каждая из *n*-мод в линейном приближении независима, то:

$$Z = \sum_{n} Z_{n} \,. \tag{36}$$

Для каждой волны

$$K_{j}$$
 (j=1,2,3); $E_{n} = \sum_{j} A_{j}b_{j}$; $Z_{n}H_{n} = \sum_{j} B_{j}b_{j}$.

Отметим, что E_n и H_n связаны уравнением Максвелла и внешнее поле $E_n = H_n$. Для полноты задачи необходимо задать вектор $B_{n,r}$ (или $M_{n,r}$) на границе, учитывая поверхностный магнетизм: $\frac{\partial M_r^{\pm}}{\partial r} - K'M_r^{\pm} = 0$; $K' = \frac{K_s}{A}$, K_s – анизотропия поверхностного магнетизма (A – обменное взаимодействие).

систвие).

Получим решение для
$$Z_n$$
:

$$Z_n = \frac{\Delta_1}{\Delta},$$

где

$$\Delta = \begin{vmatrix} H_n & B_j & . \\ 0 & A_j & . \\ 0 & X_j & . \\ 0 & Y_j & . \end{vmatrix} \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} H_n & 0 & 0 & 0 \\ A_j & B_j & . \\ . & X_j & . \\ . & Y_j & . \end{vmatrix}$$

Поэтому

$$Z_{n} = \frac{\begin{vmatrix} B_{j} & . & . \\ X_{j} & . & . \\ Y_{j} & . & . \\ \hline A_{j} & . & . \\ X_{j} & . & . \\ Y_{j} & . & . \end{vmatrix}$$

Коэффициенты А, В... Х, У имеют вид:

$$\begin{split} A_{jn} &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\mu_{-j}} J_{n-1} \left(k_{j} r \right) - \frac{1}{\mu_{+j}} J_{n+1} \left(k_{j} r \right) \right]; \\ B_{jn} &= \rho \frac{k_{j}}{\mu_{j} \phi \phi_{j} J_{n}} \left(k_{j} r \right); \\ X_{j}^{n} &= \left(\frac{1}{\mu_{0}} - \frac{1}{\mu_{-j}} \right) C_{jn}; \\ Y_{j}^{n} &= \left(\frac{1}{\mu_{0}} - \frac{1}{\mu_{+j}} \right) C_{jn}; \\ C_{jn} &= k_{j} J_{n-1}' \left(k_{j} r \right) - K' J_{n-1} \left(k_{j} r \right). \end{split}$$

Если пренебречь всеми модами *j*, кроме основного однородного резонанса, то

$$Z_n \sim \rho \quad k_4 \frac{J_{n-1}(k_4 r)}{J_n(k_4 r)}.$$

В случае, когда скин-слой много меньше радиуса, можно получить известную формулу для плоскости, когда:

где

$$Z \sim \rho k;$$

$$k \approx \mu^{\frac{1}{2}}.$$

Именно в этом приближении производились основные исследования ФМР в стандартных радиоспектроскопах.

Влияние на резонанс спиновых и поверхностных волн рассмотрим в другом сообщении. Выводы

1. Рассмотрена теория скин-эффекта на примере ферромагнитного материала при учете ферромагнитного резонанса в случае цилиндрических образцов.

2. Получена теоретическая зависимость волнового сопротивления микро- и нанопровода от его магнитной проницаемости, частоты электромагнитного поля, проводимости и радиуса провода.

3. Полученный результат позволяет анализировать эксперименты по изучению высокочастотных свойств ферромагнитных микро- и нанопроводов, что представляет очень важную проблему в свете изучения магнитных свойств метаматериалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов С.А., Зотов С.К., Ларин В.С., Торкунов А.В. Особенности естественного ферромагнитного резонанса в аморфном микропроводе // ФММ. 1991. Т.69. В. 12. С. 172–173.

2. Баранов С.А., Бержанский В.Н., Зотов С.К. и др. Ферромагнитный резонанс в аморфных магнитных проводах // ФММ. 1989. Т.67. В. 1. С. 73–78.

3. *Баранов С.А., Стоянов С.С.*, Исследование микропровода методом ферромагнитного резонанса // Электронная обработка материалов. 2006. № 3. С.191–195.

4. *Baranov S. A., Colpacovithi I., Kleimenov V., Bugakov V., Usenco V.* Composite on the basis of microwire with negative value of permeability in microwave range of frequencies // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2003. V.2. No 2. P. 174–176.

5. *Баранов С.А., Усенко В.П.* Композит из микропровода с отрицательной рефракцией // Электронная обработка материалов. 2003. № 5. С. 89–90.

6. *Kraus L.* Theory of ferromagnetic resonances in thin wires // Czechoslovak journal of physics. 1982. V. B 32. P.1264–1282.

7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М., 1957. С. 253.

8. Zuberek R., Szymezak H., Gutowski M., Zhukov A., Zhukova V., Usov N.A., Garcia K., Vazquez M. // JMMM. 2007. V. **316**. P. 890–894.

9. *Reynet O., Adenot A.-L., Deprot S., Acher O.* Effect of the magnetic properties of the inclusions on the high-frequency dielectric response // Phys. Rev. 2002. V. **B 66**, 094412–094420.

Поступила 03.08.09

Summary

The theory of skin-effect on an example of an amorphous ferromagnetic material is presented at the account of a ferromagnetic resonance. Theoretical dependence of impedance of a microwire is received from its magnetic permeability. The received result allows analyzing experiments on studying high-frequency properties of an amorphous microwire.